

FIB-SEM用ナノマニピュレータ 関連ブログとウェビナーのご案内

世界では脱炭素社会に向けた様々な取り組みが進んでいます。太陽電池材料の開発では、材料の欠陥や不純物が電荷キャリアの再結合中心となり、最終製品に大きな影響を与えます。多結晶シリコン (mc-Si) の性能に影響を及ぼす欠陥は、点状の欠陥（粒子状の不純物など）、線状の欠陥（転位）、面状の欠陥（粒界など）です。EDSを使えば化学的性質に基づいて素早く識別することができますが、粒界や転位の欠陥を素早く評価することは困難です。FIBは、ナノマニピュレータと組み合わせることでサンプルの特定箇所に正確に接触できます。

「太陽電池材料の欠陥を特定する」

> [ブログをすべて読む／技術資料ダウンロード](#)

ご存知ですか？

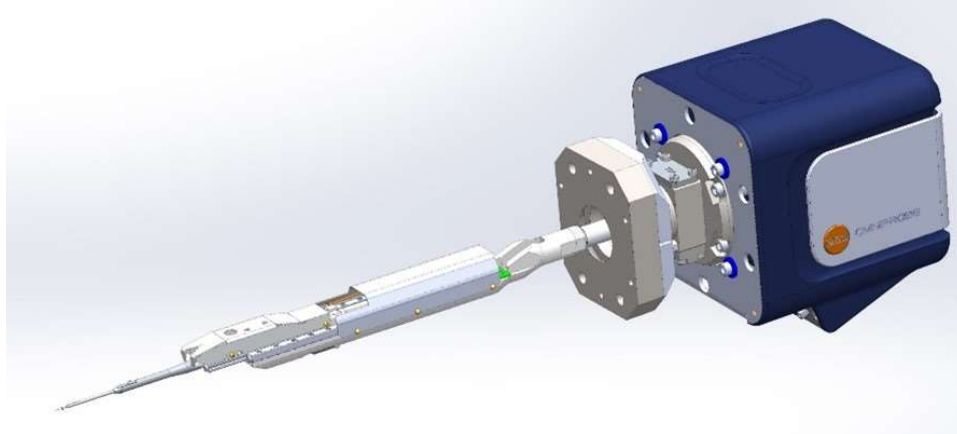
上記ブログで紹介しているナノマニピュレータは、FIBのリフトアウト法でTEM用試料を作成するツールとしてよく知られています。この他にもバイアスを利用した実験や試料の帯電軽減など様々な用途があるのをご存知ですか？今回のウェビナーでは、当社のナノマニピュレータ— OmniProbeファミリーを軸に、様々なアプリケーションをご紹介します。ナノスケールでの操作や電気特性評価の世界をぜひご覧ください。

ライブ・ウェビナー： 「ナノマニピュレータ OmniProbeのご紹介」

■ 4月28日（水） 16:00～16:30

■ 参加費：無料

■ [お申込みはこちら](#)から *バーチャルイベントの登録フォームに遷移します



さらに詳しい情報については下記までお問い合わせください。

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
分析機器事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川 3-32-42 ISビル

Tel: +81 (0) 3 6732 8967

Fax: +81 (0) 3 6732 8939

Email: na-mail.jp@oxinst.com

URL: nano.oxinst.jp

オックスフォード・インストゥルメンツについて

Oxford Instrumentsは、産業用・研究用の高度な技術ソリューションを開発・製造し、グローバルに販売やサポートを展開しています。その歴史は、英国のオックスフォード大学から独立し創業を果たした1959年に遡ります。以来60年以上にわたり、イノベーションは当社の成長と成功の原動力となってきました。次世代半導体・新世代通信・高機能材料・ヘルスケア・ライフサイエンス・量子技術・宇宙科学と、多岐にわたるアプリケーションを通じて、よりグリーンな世界への喫緊の課題解決に、当社のコア技術が採用されています。物性物理研究用の極低温無冷媒希釈冷凍機や超電導マグネットをはじめ、電子顕微鏡用の元素分析装置、レーザーや光学式イメージング装置、更には原子レベルでの半導体プロセス用プラズマ技術でのデポジション・エッチングシステムなど、当社の様々な先端テクノロジー製品をご利用ください。

© Copyright 2021 Oxford Instruments.
本メールの無断転載を禁止します

E-mailの配信停止を希望される方は、[こちら](#)をクリックしてください。
プライバシーポリシーは、[こちら](#)をご覧ください。